

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Einleitung	5
1 Anwendungsbereich	6
2 Normative Verweisungen	7
3 Begriffe und Abkürzungen	7
3.1 Begriffe	7
3.2 Abkürzungen	8
4 Reagenzien und Materialien	8
4.1 Allgemeines	8
4.2 Reagenzien	8
5 Ausrüstung	10
5.1 Allgemeines	10
5.2 Ausstattung	11
6 Probenahme	12
6.1 Allgemeines	12
6.2 Prüfmenge	12
7 Verfahren	12
7.1 Polymere	12
7.2 Metalle	16
7.3 Elektronik	17
7.4 Herstellung der Reagensblindlösung	20
8 Kalibrierung	20
8.1 Allgemeines	20
8.2 Herstellung der Kalibrierlösung	20
8.3 Erstellen der Kalibrierkurve	20
8.4 Messung der Probe	21
9 Berechnung	22
10 Präzision	22
11 Qualitätskontrolle	24
11.1 Allgemeines	24
11.2 Nachweisgrenzen (LOD) und Bestimmungsgrenzen (LOQ)	25
Anhang A (informativ) Praktische Anwendung der Bestimmung von Cd, Pb und Cr in Polymeren und Elektronik und Pb und Cd in Metallen mit AAS, AFS, ICP-OES und ICP-MS	27
Anhang B (informativ) Ergebnisse der internationalen Ringversuche Nr. 2 (IIS 2) und Nr. 4 (IIS 4A)	33
Literaturhinweise	37
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen	39

Bilder

Bild A.1 – Untergrundkorrektur	31
--------------------------------------	----

Tabellen

Tabelle 1 – Wiederholpräzision und Vergleichpräzision	23
Tabelle 2 – Annahmekriterien für Bestandteile der Qualitätskontrolle	25
Tabelle 3 – Nachweisgrenze des Verfahrens = $t \times s_{n-1}$	26
Tabelle A.1 – Spektrale Störungen bei den Wellenlängen von Cadmium und Blei	28
Tabelle A.2 – Spektrale Störungen bei den Wellenlängen von Chrom	29
Tabelle A.3 – Beispiele von Masse-Ladungs-Verhältnissen (m/z -Verhältnissen)	30
Tabelle A.4 – Beispiele von Wellenlängen für AAS	30
Tabelle A.5 – Beispiele von Wellenlängen für AFS	30
Tabelle A.6 – Programm für den Mikrowellenaufschluss von Proben	32
Tabelle B.1 – Statistische Daten für AAS	33
Tabelle B.2 – Statistische Daten für AFS	34
Tabelle B.3 – Statistische Daten für ICP-OES	35
Tabelle B.4 – Statistische Daten für ICP-MS	36